PASJ2016 MOP104

シンクロトロンからのビーム取り出し(QAR 法)の スピルフィードバック制御に関する研究

STUDY ON SPILL FEEDBACK CONTROL FOR THE BEAM EXTRACTION METHOD (QAR) FROM A SYNCHROTRON

中西哲也#, 大石量太, 地引隆之, 菅原千里

Tetsuya Nakanishi[#], Ryota Ohishi, Takayuki Jibiki, Chisato Sugawara Nihon University, College of Industrial Technology

Abstract

A feedback control of the spill structure for the slow-beam-extraction from the medical synchrotron using a fast quadruple and radio frequency (RF)-knockout (QAR method) is studied to obtain the designed spill structure. In addition the feed-forward control is used so that the feedback control is performed effectively. In this extraction method, the spill width of several ms are extracted continuously with an interval time of less than 1 ms. These controls are used to increase spill intensity at beginning of the extraction after beam acceleration. Beam simulation shows that a desired spill intensity is obtained by operating the RF-knockout with a narrower frequency band for a longer time before the first extraction, and a flat spill structure is obtained by the feed-forward and feedback controls.

1. はじめに

シンクロトロンからのビーム取り出しにおいて、スポット スキャニング照射法に適したビーム取り出し方法として QAR法(beam extraction method using a fast Quadruple magnet Assisted by RFKO)を提案している[1]。QAR法は、 高速四極電磁石(FQ)を用いてセパラトリクスを20%程度 収縮させて、セパラトリクス境界付近にあるビームを必要 量取り出し、高周波ノックアウト(RFKO)装置で周回ビー ムを拡散させて取り出されたビームが存在していた領域 を埋める。これらの操作を繰り返し行い、シンクロトロン内 のビームを取り出していく。この方法により高速で精度の よいビーム取り出しが期待できる。

QAR 法では FQ によりビームを取り出すため、任意の ビーム(スピル)構造の実現には FQ の磁場を制御する必 要がある。FQ の制御方法としてスピルフィードバック(FB) 制御と、それを効果的にするためにフィードフォワード (FF)制御とを併用して行う[2]。一方、加速ビームの横方 向の粒子密度分布がガウス分布をしている場合、取出し 初期においては一回で取出せる粒子数は少ない。そこ で、加速後にセパラトリクス中心付近の粒子を拡散させ てセパラトリクス境界付近の密度を増やす。

本研究はこれらをビームシミュレーションで行ったもの で、本論文ではビームシミュレーションの概要を述べた 後、初期取出しビームの増加、一回の取出しスピル構造 の平坦化について検討した結果について述べる。

2. ビームシミュレーションの概要

ビームシミュレーションは NIRS で設計された炭素ビー ム用コンパクトシンクロトロンのラティス[3]を使って行った。 取出し時のベアーチューンは v_x =1.68、 v_y =1.13 である。 RFKO の高周波信号は、周回粒子の拡散を一様に行う ために n+1/3 と n+2/3 (n=0,1,2,3,4)の 10 個の共鳴周波 数付近の周波数帯を含んだマルチバンドスペクトルを使 用した[4] [5]。ここで、実際の周波数は周回周波数3.485 MHz をかけた値であり、全周波数帯域は約1 MHz から 17 MHz である。このマルチバンド方式により、それぞれ の周波数帯域を任意に設定できるため、セパラトリクス境 界付近の粒子にはあまり影響を与えることなく中心付近 の粒子を拡散できる。即ち境界付近の粒子密度を増や すことができる。

セパラトリクスはビーム加速終了後に六極電磁石群を 直線的に 30000 turns の時間を掛けて立ち上げ形作ら れる。その後、セパラトリクス境界付近の粒子密度を高め るために、10000 turns 掛けてセパラトリクス中心付近の 粒子を RFKO1 により拡散する。その後、FQと RFKO2を 交互に連続で運転することでビームを断続的に取り出し ていく。タイムチャートを Figure 1 に示す。FQ の一回の 運転は、FB 制御をしない場合は立上り 6800 turns +立 下り 100 turns (0.29 μ s/turn)、RFKO2 は 3000 turns で ある。FQ と RFKO2 の運転周期は 10000 turns である。

ー回の取り出し粒子数は、FQ によるセパラトリクス収 縮率 20%で初期粒子数の約 1%が取り出されるように RFKO1,2 の蹴り角と1 バンドの周波数帯は決めた。この 時の RFKO2 のマルチバンドスペクトルの周波数帯は、 2/3 共鳴付近の端数部は0.675~0.68であった。RFKO1 は 0.6752~0.68 が最適であった。FQ は長さ 7.14cm と 設定し、K=0.0428 m⁻² で収縮率(dA/A、A は面積)が2 0%であり、これを最大値として設定している。

セプタムは中心軌道から 5.5cm 外側に設定されており、 セプタムギャップは 1cm でその中に入った時点で取り出



Figure 1: Timing chart of SX, RFKO, and FQ.

されたと判断する。初期ビームの水平方向エミッタンスは $\sigma_x \times \sigma_x' = 3.5 [\pi \text{mm·mrad}]$ でガウス分布させている。 垂直方向エミッタンスは 0.5 [$\pi \text{mm·mrad}$]とした。

シミュレーションは加速に用いられる RF は off とし、運動量分散(±0.03%[6])は計算を簡単にするために無視した。従って、運動量分散によるチューンの変化も無視している。これはクロマティシティ補正ができることも考慮している。

3. 取出し初期スピルの増加

取出し開始前に RFKO1 でセパラトリクス中心付近の 周回粒子を拡散しなかった場合と拡散した場合の結果 を Figures 2,3 に示す。但し、前者の場合、RFKO1 は RFKO2 と同じパラメータで運転した。総粒子数は 200 万 個で、図は各 100 回転の間に取出された粒子数をプロッ トし、その間は直線で結んだものである。FQ 波形はセパ ラトリクス内の粒子分布が分かるように直線的に増加する 波形を用いた。両図から明らかなように、取出し前の RFKO1 運転により、1 回目の取出し粒子数が大幅に増 えていることが分かる。この粒子数の割合は目標値であ る1%にほぼ等しかった。ここで、RFKO1 を使わなかった 場合の RFKO2 の蹴り角は、使った場合よりも 1.2 倍の大 きさとした。この値は RFKO2 を運転中に粒子が取り出さ れない最大の大きさとした。



Figure 2: Spills without RFKO1.



Figure 3: Spills with RFKO1.

Figure 4 は FF 制御をした時のスピル構造である。平坦 に近いスピル構造が得られていることが分かる。最初の スピルは、RFKO1 でセパラトリクス境界付近の粒子密度 が特に高くなっているため、同じ FQ 波形を使った場合、 前半部のスピル強度が高くなる。



Figure 4: Spills with FF control.

4. フィードバック制御

ー回の取出しにおけるスピル構造を用途に応じて 任意の形にするために、FQ 電源をスピルフィード バック制御する。しかし、周回ビームの横方向密度 分布は一般にガウス分布しているため、例えば平坦 なスピル構造を得ようとすると、初期の偏差は非常 に大きくなり目標の分布を得ることは難しい。その ため、目標とする構造に近い構造が得られるように FQ 波形を予め最適化し(FF 制御)、その波形に対 して FB 制御する。

FB 制御の K 値の変化のさせ方を下式に示す。こ の計算は 100 ターン毎に行い、次の 100 ターン後の 値を計算し、その 100 ターンの間では直線的に変化 させる[2]。

$$K_{quad}(n+1) = K_{FF} + K_P \times e_n + \sum_{j=1}^{n-1} K_P \times e_j$$

ここで、 K_{FF} は FF 制御により得られた FQ 波形、 K_P は比例係数、 e_n は目標値からの偏差である。比例係 数は一定の値ではなく、 K_{FF} の値によって変動させ ており、取り出しの後半になるにつれて減少してい く値とした。Figure 5 は Figure 4 に示したスピルに対 して FB 制御した結果である。より平坦な構造に近 づき、かつ各スピル強度も一定に近づいていること が分かる。



Figure 5: Spills with FF and FB controls.

5. 結論

QAR 法取出しにおいて、取出し初期時のスピル強度 を上げるために、予めRFKOを運転して周回粒子を拡散 した結果、最初のスピルから目標値を達成できた。更に、 FF, FB 制御により平坦なスピル構造にできることが分 かった。

参考文献

- T. Nakanishi, T. Furukawa, K. Yoshida, K. Noda, Nucl. Instr. and Meth. A553 (2005) 400.
- [2] R. Muraoka, T. Nakanishi, Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Aug. 5-7, 2015, pp. 48-50.
- [3] T. Furukawa *et al.*, Proc. of the APAC 2004, Gyeongju, Korea, pp. 420-422.
- [4] Tetsuya Nakanishi, Nuclear Instruments and Methods A 621 (2010) 62.
- [5] Akio Shinkai *et al.*, Nuclear Instruments and Methods A 769 (2015) 16-19.